

# Teradyne FLEX and SIA Integration

シグナルインテグリティの先駆者から、  
完全な信号解析ソリューションをご提供します。

設計、評価そして世界中の量産工場において、エンジニアはシグナル・インテグリティ解析という困難な挑戦に立ち向かうために、Wavecrestのソリューションを採用しています。Wavecrestの経験や知識の確かさは、私たちの信号解析装置が世界中で主要なATEプラットフォームへ1200以上も統合されている事からも明確です。

Wavecrestは、研究とATE量産テスト環境の双方において、クロック、グラフィクス、SERDESアプリケーションを効果的に活用する3つのソリューションを開発しました。設計/デバッグフェイズからデバイス評価を通して、量産と全く同じソリューションを使う事により、開発段階から量産テストまでシームレスな互換性が保証されます。包括的診断、つまり簡単に操作できるコンプライアンスツールと、タイミングおよび電圧測定の詳細な分析は共に、結果の正確さおよび反復を保証します。量産において、3つのSIA-3000シリーズは、Tr/Tfおよび振幅測定を同時に測定する事によって、テスト時間を短縮します。

## 完璧なソリューションをご提供します

テラダインFLEX ATEシステムとWavecrestのSIAソリューションを組み合わせることで、生産の前段階および量産のための6GHz帯域幅を持ったインターフェースとなります。SIAはFLEXテストシステムへ、アイマスク試験が可能なサンプリング・オシロスコープと、素晴らしい機能を備えたタイムインターバルアナライザーを加える事となります。

## テストプログラム開発を容易にします

WavecrestのGigaView™グラフィカルツールは、設計と互換性をもった効率的な33以上のツールを提供します。このツールにより、エンジニアは別のソフトウェアを追加する必要がありません。Wavecrestは更に、テスト・プログラム開発を迅速で単純にするための、量産アプリケーションプログラムインターフェイス(PAPI)ライブラリーを提供します。

## ジッタ解析

IEEE、ANSIそしてSERDESやクロック仕様書の多くに要求された、トータルジッタ(TJ)、ランダムジッタ(RJ)、ディターミニスティックジッタ(DJ)およびピリオドデッキジッタ(PJ)を分離するための完全なジッタ測定手法であるTailFitアルゴリズム(特許取得済)を用いたWavecrestのGigaViewソフトウェアをご利用下さい。



テラダイン社FLEX ATEシステムと、ウェーブクレスト社のシグナルインテグリティ解析ソリューションSIA-3000シリーズを組み合わせる事で、多くのシグナルインテグリティや、以下の様なアプリケーションに必要な、タイミングと電圧条件のテストを可能にします。

Clocks:

Advanced PLL Analysis  
Skew Timing  
Advanced Jitter Analysis

with

patented TailFit  
Bus Analysis  
Cycle to cycle

Graphics:

LVDS, TMDS, DVI

SERDES:

PCI Express  
Fibre Channel  
Gigabit Ethernet  
Many others...



ウェーブクレスト株式会社

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-46-3 大塚セントコアビル6F

Tel. 03-5960-5770 Fax. 03-5960-5773 Email. Info@wavecrestkk.co.jp

URL. www.wavecrest.com/Japan

C021rev2

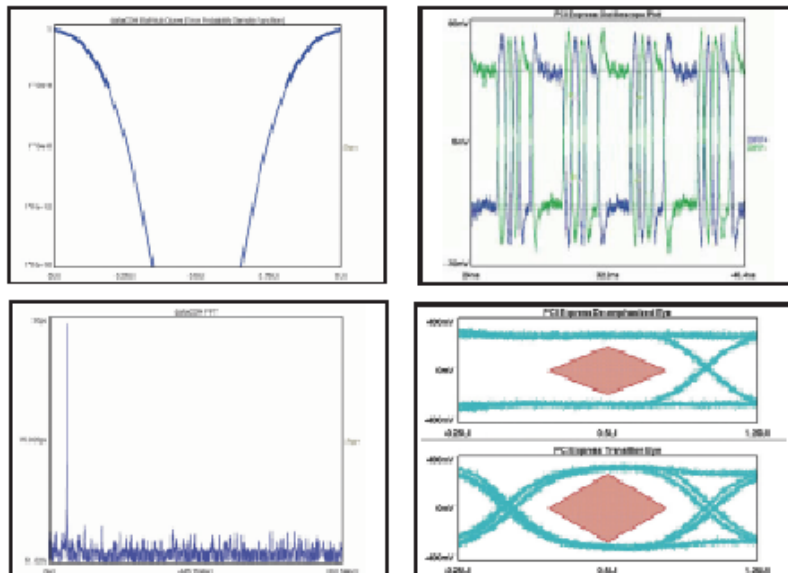
## SIA-3600T仕様について

**Data Rate:** 4.5 Gb/s all patterns  
6.5 Gb/s short patterns

**Oscilloscope:** 6 GHz 帯域幅  
同時測定可能、  
立上り・立下り時間、  
振幅ジッタ、  
overshoot/undershoot

**Input Channel:** 10 >64 w/6 GHz RF  
インターフェイス

**Input Type:** SE or DIFF



GigaView™ 測定画面例

## 測定タイプ

FULL "Time"

**Measurement:** Per, PW, RT/FF, Freq,  
Jitter, Eye Masks,  
Cycle to Cycle,  
Skew, Parallel Bus

**Special Options:** Pattern Marker  
Generator  
Clock Recovery



Sample PAPI Libraries Support  
IG-XL Test Programs  
Example: Jitter Separation